

PROGRAMME

Jeudi 15 juin 2023

08:30 **Accueil des participants (inscrits à la formation)**

09:00 Formation (pour les participants inscrits)

Découverte des techniques de caractérisations physicochimiques des surfaces et interfaces
(AFM, FIB, PO3D, SEM, TEM, TOF-SIMS, XPS)

10:30 **Pause-café**

11:00 Formation (pour les participants inscrits)

Découverte des techniques de caractérisations physicochimiques des surfaces et interfaces
(AFM, FIB, PO3D, SEM, TEM, TOF-SIMS, XPS)

12:30 **Pause déjeuner**

13:30 **Introduction de bienvenue**

SESSION 1 : Défis analytiques

13:45 SIMS et couplage LC(HR)/MS, outils complémentaires à l'analyse de produits de dégradation dans des produits cosmétiques solides

G. Provot, A. Cosette, E. Juliana, L. Gireaud*

L'OREAL

14:10 Développement d'un capteur OEM pour la détection en temps réel de particules biologiques dans l'air

L. Debard, A. Dumas*

TERA ENVIRONNEMENT

14:35 NanoMesureFrance : un point d'entrée unique pour structurer la filière industrielle des nanomatériaux autour de données fiabilisée

FX. Ouf, G. Favre*

LNE

15:00 Résultats d'essais thermiques et thermomécaniques : observation en MEB in-situ

A. Candeias

NEWTEC

15:25 **Pause-Café**

PROGRAMME

...Jeudi 15 juin 2023

SESSION 2 : Couches minces

- 15:45 Optimisation de la distance de masquage par une caractérisation fine du débord de dépôt
B. Letourneur, A. Garnier*
SAFRAN
- 16:10 Caractérisation des surfaces et des interfaces de cellules solaires en couches minces
C. Chappaz, O. Gagliano*
GARMIN
- 16:35 Dépôts multicouches déposés par plasma sur substrats polymères et PCB : caractérisations physico-chimiques et fonctionnelles (adhésion, release, anti-corrosion)
J. Jellid, N. VandenCastele, J. Viard, E. Gat, J. Vallade, S. Van Marcke*
CPI
- 17:00 Assemblage et lamination de cartes bancaires : optimisation de l'adhésion aux interfaces des couches et amélioration du visuel
B. Baudouin
SPS INGROUPE
- 17:25 Analyses de couches métalliques sur un micro-chip
B. Bortolotti, A. Garnier*
ST MICROELECTRONICS
- 17:50 **Fin de la 1^{ère} journée**
- 18:30 **Dîner surprise à la BASTIDE DE FAVE**

PROGRAMME

Vendredi 16 juin 2023

SESSION 3 : Innovation équipement

08:30 **Ouverture de la 2^{ème} journée**

08:35 Caractérisation simultanée des propriétés mécaniques et chimiques de composants métalliques par microscopie micro-onde

M. Garnier, E. Lesniewska, ...*

LICB

09:00 SEM & FIB (titre final à venir)

D. Barresi

TESCAN

09:25 Profilomètre interférométrique (titre final à venir)

M. Febvre

BRUKER

09:50 How to identify the optimal plasma treatment length for different surfaces

V. Schloupt

DATAPHYSICS

10:15 **Pause-Café**

10:35 Advances in automated XPS analysis – from data to answers

C. Blomfield, S. Hutton, AJ. Roberts, C. Moffitt, JDP. Counsell, SJ. Coultts, K. Good, K. Macak*

KRATOS

11:00 Recent developments and applications of TOF-SIMS and LEIS for surface analysis

M. Kleine-Boymann, T. Therhorst*

IONTOF

11:25 TENSOR: new STEM

D. Barresi

TESCAN

11:50 Préparation de lames minces pour MET et nettoyage Post FIB basse tension avec le PIPS

L. Legras

AMETEK

12:15 New dimensions to micro-CT imaging for industrial applications

J. Dewanckele, B. Desmet*

XRE

12:40 **Pause déjeuner**

PROGRAMME

...Vendredi 16 juin 2023

SESSION 4 : Contamination

- 14:00 Analyse multi-échelle d'une anomalie en surface d'une pièce métallique après usinage
T. Caparros
AIRBUS HELICOPTERS
- 14:25 USE CASE WITH NANOSPACE: How an analytical FIB-SEM-SIMS tool helps to understand contaminations on a wafer surface
J. Silvent
ORSAY PHYSICS
- 14:50 Une multiplicité d'agents de nettoyage, comment s'assurer d'un état de propreté conforme ?
L. Panaiva
POLYMEX
- 15:15 Conclusion
- 15:30 **Fin du Workshop**

EXPOSANTS/SPONSORS



PARTENAIRES FONDATEURS



PARTENAIRE

